



IEC 62493

Edition 2.0 2015-03

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE



**Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic field**

**Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

ICS 29.020, 29.140

ISBN 978-2-8322-2348-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	6
INTRODUCTION.....	8
1 Scope.....	9
2 Normative references .....	9
3 Terms, definitions, physical quantities, units and abbreviations .....	10
3.1 Terms and definitions.....	10
3.2 Physical quantities and units.....	12
3.3 Abbreviations .....	13
4 Limits .....	13
4.1 General.....	13
4.2 Unintentional radiating part of lighting equipment.....	14
4.2.1 General .....	14
4.2.2 Lighting equipment deemed to comply with the Van der Hoofden test without testing .....	14
4.2.3 Application of limits.....	14
4.3 Intentional radiating part of lighting equipment.....	14
5 General requirements Van der Hoofden test .....	15
5.1 Measurand.....	15
5.2 Supply voltage and frequency .....	15
5.3 Measurement frequency range.....	16
5.4 Ambient temperature.....	16
5.5 Measurement equipment requirements.....	16
5.6 Measurement instrumentation uncertainty .....	17
5.7 Test report .....	17
5.8 Evaluation of results .....	18
6 Measurement procedure for the Van der Hoofden test .....	18
6.1 General.....	18
6.2 Operating conditions .....	18
6.2.1 Operating conditions for lighting equipment .....	18
6.2.2 Operating conditions for specific lighting equipment .....	18
6.2.3 Operating conditions for lighting equipment with intentional radiators .....	19
6.3 Measurement distance .....	19
6.4 Measurement set-up .....	19
6.4.1 General .....	19
6.4.2 Measurement set-up for specific lighting equipment.....	20
6.5 Location of measurement test head .....	20
6.6 Calculation of the results .....	20
7 Assessment procedure intentional radiators.....	20
7.1 General.....	20
7.2 Low-power exclusion method .....	20
7.2.1 General .....	20
7.2.2 Determination of the total radiated power .....	21
7.2.3 Determination of the low-power exclusion level.....	21
7.2.4 Summation of multiple transmitters .....	21
7.3 Application of the EMF product standard for body worn-equipment .....	21
7.4 Application of the EMF product standard for base stations .....	21

7.5	Application of another EMF standard .....	21
Annex A (normative)	Measurement distances .....	23
Annex B (informative)	Location of measurement test head .....	24
Annex C (informative)	Exposure limits .....	29
C.1	General.....	29
C.2	ICNIRP .....	29
C.2.1	ICNIRP 1998 .....	29
C.2.2	ICNIRP 2010 .....	29
C.3	IEEE .....	29
Annex D (informative)	Rationale measurement and assessment method.....	31
D.1	General.....	31
D.2	Induced internal electric field .....	31
D.2.1	General .....	31
D.2.2	Induced electric field due to the magnetic field; $E_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}})$ .....	33
D.2.3	Induced electric field due to the electric field; $E_{\text{cap}}(f_i, d)$ .....	38
D.3	Thermal effects from 100 kHz to 300 GHz.....	41
D.3.1	General .....	41
D.3.2	The 100 kHz to 30 MHz contribution to the thermal effects .....	42
D.3.3	The 30 MHz to 300 MHz contribution to the thermal effects .....	43
D.3.4	Overall conclusion for the contribution to thermal effects .....	44
Annex E (normative)	Practical internal electric-field measurement and assessment method .....	45
E.1	Measurement of induced internal electric field.....	45
E.2	Calculation program.....	45
E.3	Compliance criterion for the Van der Hoofden head test.....	46
Annex F (normative)	Protection network .....	47
F.1	Calibration of the protection network.....	47
F.2	Calculation of the theoretical characteristic of the protection network.....	48
Annex G (informative)	Measurement instrumentation uncertainty .....	50
Annex H (informative)	Equipment deemed to comply .....	52
Annex I (informative)	Intentional radiators.....	54
I.1	General.....	54
I.2	Intentional radiators in lighting equipment.....	54
I.3	Properties of antennas in lighting applications .....	54
I.4	Exposure assessment approach.....	60
I.4.1	General .....	60
I.4.2	Determination of average total radiated power $P_{\text{int,rad}}$ .....	60
I.4.3	Determination of the low-power exclusion level $P_{\text{max}}$ .....	61
I.5	Multiple transmitters in a luminaire.....	61
I.6	Exposure to multiple luminaires .....	62
I.7	References in Annex I.....	62
Bibliography.....		64
Figure 1 – Compliance routes and pass/fail criteria for lighting equipment .....		15
Figure 2 – The Van der Hoofden test head.....		16
Figure 3 – Example of a protection circuit .....		17

Figure 4 – Measurement set-up .....	19
Figure 5 – Compliance demonstration procedure for the intentional-transmitter part of the lighting equipment.....	22
Figure B.1 – Location of measurement point in the transverse direction of lighting equipment – side view .....	24
Figure B.2 – Location of measurement points in the longitude direction of lighting equipment – side view .....	24
Figure B.3 – Location of measurement points in the longitude direction of lighting equipment; in the direction of illumination .....	25
Figure B.4 – Location of measurement point for lighting equipment with rotationally symmetrical dimensions.....	25
Figure B.5 – Location of measurement point for lighting equipment with rotationally symmetrical dimensions; in the direction of illumination .....	26
Figure B.6 – Location of measurement point for lighting equipment with the same dimensions in the <i>x</i> - and <i>y</i> - axis .....	26
Figure B.7 – Location of measurement point(s) for lighting equipment with single capped lamp (360° illumination).....	27
Figure B.8 – Location of measurement points for lighting equipment with a remote controlgear .....	27
Figure B.9 – Location of measurement point for an independent electronic converter .....	28
Figure B.10 – Location of measurement point(s) for an uplighter (floor standing/suspended).....	28
Figure D.1 – Overview measurement and assessment method.....	31
Figure D.2 – Distances of the head, loop and measurement set-up.....	33
Figure D.3 – Maximum current in the 2 m LLA as function of the frequency .....	35
Figure D.4 – Induced internal electric field and associated limit levels .....	37
Figure D.5 – Example of magnetic-field test result using the LLA.....	38
Figure D.6 – Distances of the head and measurement set-up .....	39
Figure D.7 – Plot of Equation (D.20) .....	39
Figure D.8 – Example of the CM-current measured using a conducted emission test .....	43
Figure F.1 – Test set-up for normalization of the network analyser.....	47
Figure F.2 – Test set-up for measurement of the voltage division factor using a network analyser.....	48
Figure F.3 – Calculated theoretical characteristic for the calibration of the protection network.....	49
Figure H.1 – Flow chart to determine applicability deemed to comply without <i>F</i> factor measurement.....	53
Figure I.1 – Luminaire with a transmitting antenna in a room.....	56
Figure I.2 – Impact of a conducting ceiling/plane .....	57
Figure I.3 – Electric field of a small electrical dipole: analytical formula vs far-field approximation .....	58
Figure I.4 – Electric field as a function of distance, antenna gain and input power (far-field approximation) .....	59
Figure I.5 – Impact of pulsed signals on the average exposure .....	60
Table 1 – Physical quantities and units .....	13
Table 2 – Receiver or spectrum analyser settings .....	16
Table A.1 – Lighting equipment and measurement distances .....	23

Table C.1 – Basic restrictions for general public exposure to time varying electric and magnetic fields for frequencies between 100 kHz and 10 GHz .....	29
Table C.2 – Basic restrictions for general public exposure to time varying electric and magnetic fields for frequencies up to 10 MHz .....	29
Table C.3 – IEEE basic restrictions (BR) for the general public .....	30
Table C.4 – IEEE basic restrictions (BR) between 100 kHz and 3 GHz for the general public.....	30
Table D.1 – Induced internal electric field calculations .....	34
Table D.2 – Calculation main contributions .....	40
Table D.3 – Frequency steps for the amplitude addition that equals 1,11 times $B_6$ .....	41
Table D.4 – Frequency steps for the power addition that equals 0,833 times $B_6$ .....	42
Table D.5 – Field strength limits according to CISPR 15 .....	43
Table E.1 – Conductivity as a function of frequency (see Table C.1 of IEC 62311:2007) .....	46
Table G.1 – Uncertainty calculation for the measurement method described in Clauses 5 and 6 in the frequency range from 20 kHz to 10 MHz .....	50
Table G.2 – Comments and information to Table G.1 .....	51
Table I.1 – Overview of wireless radio technologies that might be applied in lighting systems .....	55

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

### **ASSESSMENT OF LIGHTING EQUIPMENT RELATED TO HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS**

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62493 has been prepared by IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2009. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) identification of lighting product types deemed to comply with the standard without the need for test;
- b) deletion of the need for CISPR-15-compliance as a prerequisite for IEC 62493 compliance;
- c) inclusion of the consequences of the ICNIRP 2010 guidelines for (up to 100 kHz);
- d) adding some guidance to the Van der Hoofden test head method to improve reproducibility of results;
- e) inclusion of compliance demonstration method for products having intentional radiators.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34/222/FDIS	34/228/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62493 series, published under the general title *Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields*, can be found on the IEC website.

The exposure limits given in Annex C (informative) are for information only; they do not comprise an exhaustive list and are valid only in certain regions of the world. It is the responsibility of users of this standard to ensure that they use the current version of the limit values specified by the applicable national authorities.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

This International Standard establishes a suitable evaluation method for the influence of the electromagnetic fields in the space around the equipment mentioned in the scope, and defines standardized operating conditions and measurement distances.

This standard is designed to assess, by measurements and/or calculations, electromagnetic (EM) fields and their potential effect on the human body by reference to exposure levels of the general public given by ICNIRP:1998 [1]<sup>1</sup>, ICNIRP 2010 [2], IEEE C95.1:2005 [3] and IEEE C95.6:2002 [4]. The exposure levels with which to comply are basic restrictions (both ICNIRP- and IEEE-based).

Based on the lighting equipment operating properties, the frequency range of the applicable basic restrictions can be limited as follows:

- internal electric field between 20 kHz and 10 MHz;
- specific absorption rate (SAR) between 100 kHz and 300 MHz;
- power density is outside the scope.

NOTE Operating frequencies of lighting equipment are higher than 20 kHz to avoid audible noise and infrared interference. Frequency contributions above 300 MHz can be neglected.

This standard is not meant to supplant definitions and procedures specified in exposure standards, but it is aimed at supplementing the procedure already specified for compliance with exposure.

---

<sup>1</sup> Numbers in square brackets refer to the Bibliography.



# ASSESSMENT OF LIGHTING EQUIPMENT RELATED TO HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

## 1 Scope

This International Standard applies to the assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields. The assessment consists of the induced internal electric field for frequencies from 20 kHz to 10 MHz and the specific absorption rate (SAR) for frequencies from 100 kHz to 300 MHz around lighting equipment.

Included in the scope of this standard are:

- all lighting equipment with a primary function of generating and/or distributing light intended for illumination purposes, and intended either for connection to the low voltage electricity supply or for battery operation; used indoor and/or outdoor;
- lighting part of multi-function equipment where one of the primary functions of this is illumination;
- independent auxiliaries exclusively for the use with lighting equipment;
- lighting equipment including intentional radiators for wireless communication or control.

Excluded from the scope of this standard are:

- lighting equipment for aircraft and airfields;
- lighting equipment for road vehicles; (except lighting used for the illumination of passenger compartments in public transport)
- lighting equipment for agriculture;
- lighting equipment for boats/vessels;
- photocopiers, slide projectors;
- apparatus for which the requirements of electromagnetic fields are explicitly formulated in other IEC standards.

NOTE The methods described in this standard are not suitable for comparing the fields from different lighting equipment.

This standard does not apply to built-in components for luminaires such as electronic controlgear.

## 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62209-2:2010, *Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices – Human models, instrumentation, and procedures – Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)*

IEC 62232:2011, *Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure*

IEC 62311:2007, *Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)*

IEC 62479:2010, *Assessment of the compliance of low-power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)*

CISPR 16-1-1, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	70
INTRODUCTION.....	72
1 Domaine d'application .....	73
2 Références normatives .....	73
3 Termes, définitions, grandeurs physiques, unités et abréviations.....	74
3.1 Termes et définitions .....	74
3.2 Grandeurs physiques et unités.....	77
3.3 Abréviations.....	77
4 Limites.....	78
4.1 Généralités .....	78
4.2 Partie de l'équipement d'éclairage présentant un rayonnement non intentionnel .....	78
4.2.1 Généralités.....	78
4.2.2 Equipement d'éclairage considéré comme satisfaisant à l'essai de Van der Hoofden sans essai .....	78
4.2.3 Application des limites .....	79
4.3 Partie de l'équipement d'éclairage présentant un rayonnement intentionnel.....	79
5 Exigences générales de l'essai de Van der Hoofden.....	80
5.1 Mesurage.....	80
5.2 Tension et fréquence d'alimentation.....	81
5.3 Gamme des fréquences de mesure.....	81
5.4 Température ambiante .....	81
5.5 Exigences en matière d'équipement de mesure .....	81
5.6 Incertitude liée à l'instrumentation de mesure .....	83
5.7 Rapport d'essai.....	83
5.8 Evaluation des résultats.....	83
6 Procédure de mesure pour l'essai de Van der Hoofden .....	84
6.1 Généralités .....	84
6.2 Conditions de fonctionnement.....	84
6.2.1 Conditions de fonctionnement de l'équipement d'éclairage .....	84
6.2.2 Conditions de fonctionnement d'un équipement d'éclairage spécifique .....	84
6.2.3 Conditions de fonctionnement d'un équipement d'éclairage doté de éléments rayonnants intentionnels.....	84
6.3 Distance de mesure .....	84
6.4 Montage de mesure .....	85
6.4.1 Généralités.....	85
6.4.2 Montage de mesure d'un équipement d'éclairage spécifique.....	85
6.5 Emplacement de la tête d'essai de mesure .....	86
6.6 Calcul des résultats .....	86
7 Éléments rayonnants intentionnels de la procédure d'évaluation .....	86
7.1 Généralités .....	86
7.2 Méthode d'exclusion à faible puissance .....	86
7.2.1 Généralités.....	86
7.2.2 Détermination de la puissance totale rayonnée.....	87
7.2.3 Détermination du niveau d'exclusion à faible puissance.....	87
7.2.4 Addition d'émetteurs multiples .....	87

7.3	Application de la norme de produit sur les EMF pour les équipements portés près du corps .....	87
7.4	Application de la norme de produit sur les EMF pour les stations de base.....	87
7.5	Application d'une autre norme sur les EMF .....	88
Annexe A (normative) Distances de mesure.....		89
Annexe B (informative) Emplacement de la tête d'essai de mesure.....		90
Annexe C (informative) Limites d'exposition.....		95
C.1	Généralités .....	95
C.2	ICNIRP .....	95
C.2.1	ICNIRP 1998 .....	95
C.2.2	ICNIRP 2010 .....	95
C.3	IEEE .....	96
Annexe D (informative) Méthode justificative d'évaluation et de mesure.....		97
D.1	Généralités .....	97
D.2	Champ électrique interne induit.....	97
D.2.1	Généralités .....	97
D.2.2	Champ électrique induit dû au champ magnétique; $E_{\text{Foucault}}(f_i, d_{\text{boucle}})$ .....	99
D.2.3	Champ électrique induit dû au champ électrique; $E_{\text{cap}}(f_i, d)$ .....	104
D.3	Effets thermiques de 100 kHz à 300 GHz.....	108
D.3.1	Généralités .....	108
D.3.2	Contribution 100 kHz à 30 MHz aux effets thermiques .....	108
D.3.3	Contribution 30 MHz à 300 MHz aux effets thermiques .....	110
D.3.4	Conclusion globale concernant la contribution aux effets thermiques .....	111
Annexe E (normative) Méthode pratique d'évaluation et de mesure des champs électriques internes .....		112
E.1	Mesure du champ électrique interne induit .....	112
E.2	Programme de calcul .....	112
E.3	Critère de conformité pour l'essai de tête de Van der Hoofden .....	113
Annexe F (normative) Réseau de protection .....		115
F.1	Etalonnage du réseau de protection.....	115
F.2	Calcul de la caractéristique théorique du réseau de protection.....	116
Annexe G (informative) Incertitude liée à l'instrumentation de mesure .....		118
Annexe H (informative) Equipement considéré conforme .....		120
Annexe I (informative) Éléments rayonnants intentionnels .....		122
I.1	Généralités .....	122
I.2	Éléments rayonnants intentionnels dans les équipements d'éclairage .....	122
I.3	Propriétés des antennes dans les applications d'éclairage.....	122
I.4	Approche d'évaluation d'exposition .....	129
I.4.1	Généralités .....	129
I.4.2	Détermination de la puissance totale rayonnée moyenne $P_{\text{int,rad}}$ .....	129
I.4.3	Détermination du niveau d'exclusion à faible puissance $P_{\text{max}}$ .....	130
I.5	Emetteurs multiples d'un luminaire.....	131
I.6	Exposition à des luminaires multiples.....	131
I.7	Références à l'Annexe I .....	132
Bibliographie.....		133

Figure 1 – Marches à suivre pour l'établissement de la conformité et critères d'acceptation/échec pour l'équipement d'éclairage .....	80
Figure 2 – Tête d'essai Van der Hoofden .....	82
Figure 3 – Exemple de circuit de protection .....	82
Figure 4 – Montage de mesure .....	85
Figure 5 – Procédure de démonstration de conformité pour la partie de l'équipement d'éclairage comportant un émetteur intentionnel .....	88
Figure B.1 – Emplacement du point de mesure dans la direction transversale de l'équipement d'éclairage – vue de côté .....	90
Figure B.2 – Emplacement des points de mesure dans la direction longitudinale de l'équipement d'éclairage – vue de côté .....	90
Figure B.3 – Emplacement des points de mesure dans la direction longitudinale de l'équipement d'éclairage; dans la direction de l'éclairage .....	91
Figure B.4 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage dont les dimensions présentent une symétrie de rotation .....	91
Figure B.5 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage dont les dimensions présentent une symétrie de rotation; dans la direction de l'éclairage .....	92
Figure B.6 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage ayant des dimensions identiques sur l'axe $x$ et l'axe $y$ .....	92
Figure B.7 – Emplacement du ou des points de mesure d'un équipement d'éclairage avec lampe à un seul culot (éclairage à 360°) .....	93
Figure B.8 – Emplacement des points de mesure d'un équipement d'éclairage muni d'un appareillage à distance .....	93
Figure B.9 – Emplacement du point de mesure d'un convertisseur électronique indépendant .....	94
Figure B.10 – Emplacement du/des points de mesure d'un luminaire à éclairage dirigé vers le haut (au sol/suspendu) .....	94
Figure D.1 – Vue d'ensemble de la méthode d'évaluation et de mesure .....	97
Figure D.2 – Distances de la tête, de la boucle et du montage de mesure .....	99
Figure D.3 – Courant maximal dans la LLA de 2 m, en fonction de la fréquence .....	101
Figure D.4 – Champ électrique interne induit et niveaux limites associés .....	103
Figure D.5 – Exemple de résultat d'essai de champ magnétique utilisant la LLA .....	104
Figure D.6 – Distances entre la tête et le montage de mesure .....	105
Figure D.7 – Courbe de l'Equation (D.20) .....	106
Figure D.8 – Exemple du courant $I_{cm}$ mesuré au moyen d'un essai d'émission conduite .....	110
Figure F.1 – Montage d'essai pour l'étalonnage de l'analyseur de réseau .....	115
Figure F.2 – Montage d'essai pour la mesure du facteur de division en tension à l'aide d'un analyseur de réseau .....	116
Figure F.3 – Caractéristique théorique calculée pour l'étalonnage du réseau de protection .....	117
Figure H.1 – Organigramme pour déterminer l'applicabilité de la conformité sans mesure de facteur $F$ .....	121
Figure I.1 – Luminaire avec antenne d'émission dans une pièce .....	125
Figure I.2 – Influence d'un plafond/plan conducteur .....	126
Figure I.3 – Champ électrique d'un petit doublet électrique: formule analytique en fonction de l'approximation de champ lointain .....	127
Figure I.4 – Champ électrique en fonction de la distance, du gain d'antenne et de la puissance d'entrée (approximation de champ lointain) .....	128

Figure I.5 – Influence des signaux d’impulsions sur l’exposition moyenne .....	130
Tableau 1 – Grandeurs physiques et unités .....	77
Tableau 2 – Réglages du récepteur ou de l’analyseur de spectre .....	81
Tableau A.1 – Equipement d’éclairage et distances de mesure .....	89
Tableau C.1 – Restrictions de base concernant l’exposition du grand public aux champs électriques et magnétiques variant dans le temps, pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz .....	95
Tableau C.2 – Restrictions de base concernant l’exposition du grand public aux champs électriques et magnétiques variant dans le temps pour des fréquences allant jusqu’à 10 MHz .....	95
Tableau C.3 – Restrictions de base (BR) de l’IEEE pour le grand public .....	96
Tableau C.4 – Restrictions de base (BR) de l’IEEE entre 100 kHz et 3 GHz pour le grand public .....	96
Tableau D.1 – Calculs de champ électrique interne induit .....	100
Tableau D.2 – Calcul des contributions du réseau .....	106
Tableau D.3 – Pas en fréquence pour l’addition d’amplitude égal à 1,11 fois $B_6$ .....	107
Tableau D.4 – Pas en fréquence pour l’addition des puissances égal à 0,833 fois $B_6$ .....	108
Tableau D.5 – Limites d’intensité du champ selon la CISPR 15 .....	111
Tableau E.1 – Conductivité en fonction de la fréquence (voir Tableau C.1 de l’IEC 62311:2007) .....	113
Tableau G.1 – Calcul de l’incertitude pour la méthode de mesure décrite à l’Article 5 et à l’Article 6 dans la gamme de fréquences comprises entre 20 kHz et 10 MHz .....	118
Tableau G.2 – Commentaires et informations relatifs au Tableau G.1 .....	119
Tableau I.1 – Présentation des technologies radio sans fil qui sont susceptibles d’être appliquées aux systèmes d’éclairage .....	124

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### ÉVALUATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE RELATIVEMENT À L'EXPOSITION HUMAINE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62493 a été établie par le comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 2009. Cette édition constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) identification des types de produits d'éclairage considérés comme satisfaisant à la norme sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais;
- b) suppression de la condition préalable consistant à se conformer à la norme CISPR 15 pour satisfaire aux exigences de l'IEC 62493;
- c) inclusion des conséquences des lignes directrices de l'ICNIRP 2010 (jusqu'à 100 kHz);

- d) ajout de recommandations pour la "méthode de la tête d'essai de Van der Hoofden" afin d'améliorer la reproductibilité des résultats;
- e) inclusion de la méthode de démonstration de conformité des produits dotés d'éléments rayonnants intentionnels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34/222/FDIS	34/228/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62493, publiées sous le titre général *Evaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les limites d'exposition indiquées à l'Annexe C (informative) sont données pour information seulement; elles ne constituent pas une liste exhaustive et ne sont valables que dans certaines régions du monde. Il est de la responsabilité des utilisateurs de la présente norme de s'assurer qu'ils utilisent la version en cours des valeurs limites spécifiées par les autorités nationales concernées.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**



## INTRODUCTION

La présente Norme internationale établit une méthode d'évaluation appropriée concernant l'influence des champs électromagnétiques dans l'espace situé autour des équipements mentionnés dans le domaine d'application. Elle définit également les conditions de fonctionnement et les distances de mesure normalisées.

Cette norme est conçue pour évaluer, grâce à des mesures et/ou à des calculs, les champs électromagnétiques (EM) et leur effet potentiel sur le corps humain, en référence aux niveaux d'exposition du grand public qui sont donnés dans l'ICNIRP:1998 [1]<sup>1</sup>, l'ICNIRP 2010 [2], l'IEEE C95.1:2005 [3] et l'IEEE C95.6:2002 [4]. Les niveaux d'exposition auxquels satisfaire correspondent aux restrictions de base (reposant à la fois sur l'ICNIRP et l'IEEE).

En fonction des propriétés de fonctionnement de l'équipement d'éclairage, la gamme de fréquences des restrictions de base applicables peut être limitée comme suit:

- champ électrique interne entre 20 kHz et 10 MHz;
- débit d'absorption spécifique (DAS) compris entre 100 kHz et 300 MHz;
- densité de puissance en dehors du domaine d'application.

NOTE Les fréquences de fonctionnement de l'équipement d'éclairage sont supérieures à 20 kHz, pour éviter les bruits audibles et les interférences infrarouges. Les contributions de fréquence au-delà de 300 MHz peuvent être négligées.

Cette norme n'a pas pour but de remplacer les définitions et procédures spécifiées dans les normes relatives à l'exposition, mais de compléter la procédure déjà spécifiée pour la conformité à l'exposition.

---

<sup>1</sup> Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie.

# ÉVALUATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE RELATIVEMENT À L'EXPOSITION HUMAINE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

## 1 Domaine d'application

La présente Norme internationale traite de l'évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques. L'évaluation comprend le champ électrique interne induit pour les fréquences comprises entre 20 kHz et 10 MHz et le débit d'absorption spécifique (DAS) pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 300 MHz autour de l'équipement d'éclairage.

Sont inclus dans le domaine d'application de la présente norme:

- tous les équipements d'éclairage ayant pour fonction principale de générer et/ou de répartir la lumière à des fins d'éclairage, et destinés à être raccordés soit à une alimentation électrique basse tension soit à une batterie, pour utilisation en intérieur et/ou en extérieur;
- la partie des appareils à fonctions multiples destinée à l'éclairage lorsqu'une des principales fonctions de ces appareils est l'éclairage lumineux;
- les organes auxiliaires indépendants, à utiliser exclusivement avec l'équipement d'éclairage;
- les équipements d'éclairage contenant intentionnellement des éléments rayonnants pour les communications ou les commandes sans fil.

Sont exclus du domaine d'application de la présente norme:

- les équipements d'éclairage des avions et des aéroports;
- les équipements d'éclairage des véhicules routiers (excepté l'éclairage des compartiments passagers dans les transports en commun)
- les équipements d'éclairage agricoles;
- les équipements d'éclairage des bateaux/navires;
- les photocopieurs, les projecteurs de documents;
- les appareils pour lesquels les exigences en matière de champs électromagnétiques sont formulées de manière explicite dans d'autres normes IEC.

NOTE Les méthodes décrites dans la présente norme ne sont pas adaptées pour comparer les champs de différents équipements d'éclairage.

La présente norme ne s'applique pas aux composants intégrés dans des luminaires, tels que des appareillages électroniques.

## 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62209-2:2010, *Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps – Modèles de corps humain, instrumentation et procédures – Partie 2: Procédure de détermination du débit*

*d'absorption spécifique produit par les appareils de communications sans fil utilisés très près du corps humain (gamme de fréquences de 30 MHz à 6 GHz)*

*IEC 62232:2011, Détermination des champs radiofréquences et du DAS aux environs des stations de base utilisées pour les communications radio dans le but d'évaluer l'exposition humaine*

*IEC 62311:2007, Evaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz)*

*IEC 62479:2010, Evaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance avec les restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)*

*CISPR 16-1-1, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques. Partie 1-1: Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*